

ポスター番号	機関番号	題名	発表者	所属	カテゴリ
兵庫県					
P46	H-01	兵庫県ビームラインにおける産業分野支援の現状	放射光研究センター	兵庫県 BL24XU&BL08B2&放射光研究センター	ビームライン・施設
P03	H-02	ベイズ推定を用いた電池材料のNAP-HAXPESスペクトル解析	山本 知樹	マツダ(株)	エネルギー
P13	H-03	放射光X線トポグラフィによるSiC結晶中の転位の観察	鎌田 功穂	(一財)電力中央研究所	半導体・電子材料
P14	H-04	明視野X線トポグラフィによるNa-flux GaN/Ammonothermal GaN結晶中の転位評価	楠本 大智	兵庫県立大学	半導体・電子材料
P16	H-05	放射光X線によるGaN単結晶基板の格子定数評価	澤田 拓磨	兵庫県立大学	半導体・電子材料
P38	H-06 (HO-01)	醤油醸造における原料分解の見える化	眞岸 範浩	ヒガシマル醤油(株)	食品
P34	H-07 (HO-02)	小角散乱を用いたバイオマテリアル分析	中田 克	(株)東レリサーチセンター	生体・医療
P20	H-08 (HO-03)	ニュースバル放射光施設でのEUVリソグラフィ研究と放射光分析研究	原田 哲男	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所	半導体・電子材料
P21	H-09 (HO-04)	アモルファス炭素膜の構造解析の新しい展開	神田 一浩	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所	無機材料
P39	H-10	ニュースバル放射光施設における光源開発	橋本 智	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所	装置・分析技術
P22	H-11	原子状水素照射を利用したDLC薄膜の深さ方向分析	春山 雄一	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所	無機材料
P40	H-12	ニュースバル放射光施設における実材料のX線吸収分光分析	中西 康次	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所	装置・分析技術
P04	H-13	リチウムイオン電池正極の軟X線吸収分析による充放電状態の解析	末広 省吾	(株)住化分析センター	エネルギー
サンビーム					
P47	S-01 (SO-01)	サンビーム新体制による活動状況	三輪 靖雄	川崎重工業(株)	ビームライン・施設
P09	S-02	CO ₂ 還元触媒の高温反応ガス雰囲気中でのin-situ XAFS分析	清瀧 元	川崎重工業(株)	触媒
P06	S-03	放射光X線CTを用いた硫化物系固体電解質の評価	林 和志	(株)神戸製鋼所	エネルギー
P25	S-04 (SO-02)	引張その場XRDマッピングによる銅の局所変形挙動可視化	徳田 一弥	住友電気工業(株)	構造材料・金属
P17	S-05	HAXPESを活用した化合物半導体の評価	井崎 学	住友電気工業(株)	半導体・電子材料
P08	S-06	CO ₂ 電解セルのオペランド X線ラジオグラフィ観察	沖 充浩	(株)東芝	エネルギー
P41	S-07	サンビームのHAXPES装置	吉木 昌彦	(株)東芝	装置・分析技術
P15	S-08	放射光を用いた反射X線トポグラフィによるGaN基板の評価	兼近 将一	名古屋大学	半導体・電子材料
P24	S-09 (SO-03)	月面有人圧ローバトランスミッション開発における放射光利用	高橋 直子	(株)豊田中央研究所	機械・自動車
JASRI実施課題					
P42	J-01	30 keV励起硬X線光電子分光法の標準化に向けた取り組み	西原 達平	(公財)高輝度光科学研究センター	装置・分析技術
P18	J-02	ナノビームX線回折法を用いた積層セラミックコンデンサのNi電極/素子界面近傍の結晶構造解析	渡辺 研太郎	(株)村田製作所	半導体・電子材料
P12	J-03	バイオマス変換に向けた二元金属触媒ナノ粒子触媒のXAFSによる構造解析	水垣 共雄	大阪大学	触媒
P26	J-04	電子ビーム金属3Dプリンタにより作製したAl-Si積層造形合金における弾塑性変形挙動の観察	足立 大樹	兵庫県立大学	構造材料・金属
P31	J-05	小角X線散乱測定による溶剤ストレスクレーシング過程における凝集構造解析	永野 千草	三菱電機(株)	有機材料
P01	J-06	HAXPESを用いた太陽電池用電極の新規ペースト材料の評価	箕輪 卓哉	明治大学	エネルギー
P32	J-07	SAXS-レオロジー同時測定によるシアシックニング流体の構造解析	赤田 圭史	(公財)高輝度光科学研究センター	有機材料
P45	J-08	XAFS品質チェックプログラムの開発と展開	漆原 良昌	(公財)高輝度光科学研究センター	装置・分析技術
P43	J-09	BL13XU, BL16XU, BL19B2の多目的6軸回折計の現状	小金澤 智之	(公財)高輝度光科学研究センター	装置・分析技術
P02	J-10	μ-HAXPESによるリチウムイオン二次電池混合負極の被膜状態分析	馬場 輝久	(株)日産アーク	エネルギー
P30	J-11	マルチスケールCTを用いたAl接着剤界面の観察	稲葉 雅之	(株)日産アーク	構造材料・金属

ポスター番号	機関番号	題名	発表者	所属	カテゴリ
P05	J-12	nano-CTを用いたリチウムイオン電池負極活物質粒子の充放電による膨張収縮の観察	伊藤 孝憲	(株)日産アーク	エネルギー
P07	J-13	実用電線中に見出された電気トリー拠点微小異物のCT/XRD複合実験による非破壊組成分析	伊藤 桂介	宮城県産業技術総合センター	エネルギー
P48	J-14 (JO-01)	JASRIにおけるワンストップ利用支援の立上げについて	佐藤 眞直	(公財)高輝度光科学研究センター	ビームライン・施設
P49	J-15	JASRI-岡山大学連携によるSPring-8産業利用促進の取り組み	堀金 和正	岡山大学	ビームライン・施設
P27	J-16 (JO-05)	高能率・高精度なマイクロフィブリル配向評価法の開発	馬込 栄輔	九州シンクロトロン光研究センター	構造材料・金属
P35	J-17 (JO-06)	時分割USAXSによるチーズ製造における凝乳挙動の観察	金田 勇	酪農学園大学	食品
P36	J-18	X線回折を用いた粉体圧縮成形物の表面硬化層中の結晶層厚さの特定と結晶化成分分布の計測	神谷 哲	長瀬産業(株)	食品
P37	J-19	粉体の圧縮成形時における粒子再配列と粒子接点の可視化	神谷 哲	長瀬産業(株)	食品
(株)豊田中央研究所					
P23	T-01	ハイスループット実験と統計モデリングによる金属有機構造体ゲルの形成条件の解明	宮崎 伊弦	(株)豊田中央研究所	無機材料
P44	T-02	放射光X線マイクロCT計測のスループット向上の検討	山口 聡	(株)豊田中央研究所	装置・分析技術
P11	T-03	In situ 昇温蛍光XAFS 法による触媒内微量元素の化学状態評価	山本 敏生	(株)豊田中央研究所	触媒
P10	T-04	In situ 蛍光XAFS法によるCO還元Ag修飾Cu系電極触媒の酸化状態解析	西村 友作	(株)豊田中央研究所	触媒
P28	T-05	樹脂金属直接接合体の樹脂結晶構造と力学物性	米山 弘亮	(株)豊田中央研究所	構造材料・金属
P29	T-06	放射光ラミノグラフィによる短繊維強化プラスチックの疲労内部損傷解析	木村 英彦	(株)豊田中央研究所	構造材料・金属
P19	T-07	走査型3DXRD法による電子基板はんだ接合部の耐久前後の評価	岸田 佳大	(株)豊田中央研究所	半導体・電子材料
FSBL (フロンティアソフトマター)					
P33	F-01	セルロースナノファイバー(CNF)強化ポリアミドの界面制御に関する解析	舟久保 翔太	旭化成(株)	有機材料
その他					
P50	O-01	佐賀県における地域産業への貢献	妹尾 与志木	佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター	ビームライン・施設
P52	O-02	「富岳」を中核とするHPCIの利用方法とRISTの利用支援	須永 泰弘	(一財)高度情報科学技術研究機構	ビームライン・施設
P53	O-03	J-PARC MLFの中性子利用推進活動	舟越 賢一	(一財)総合科学研究機構・中性子科学センター	ビームライン・施設
P51	O-04	あいちシンクロトロン光センターの現状	平野辰巳	(公財)科学技術交流財団	ビームライン・施設
P54	O-05	中性子産業利用推進協議会の活動	小室 又洋	中性子産業利用推進協議会	ビームライン・施設
P56	O-06	SPring-8-IIの利用提案と未来社会への貢献	田中 眞奈子	SPring-8ユーザー協同体	ビームライン・施設
P57	O-07	SPring-8の利用制度について	利用推進部	(公財)高輝度光科学研究センター	ビームライン・施設
P55	O-08	SPring-8利用推進協議会について		SPring-8利用推進協議会	ビームライン・施設